УДК 535.34

ДВУХВАЛЕНТНЫЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ИОНЫ В КРИСТАЛЛАХ LaF₃

© 2017 г. Е. А. Раджабов^{1,2*}, А. В. Самборский²

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии имени А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск

 $^2\Phi$ едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Иркутский государственный университет"

E-mail: eradzh@igc.irk.ru

Исследованы оптические спектры и электропроводность кристаллов LaF₃ с примесью 0.01, 0.1, 0.3 мол.% YbF₃, в которых Yb частично или полностью перешел в двухвалентное состояние. Длинноволновая полоса поглощения при 370 нм обусловлена переходами электрона с состояния $4f^{14}$ на уровень зарядокомпенсирующей вакансии. Остальные полосы 300–190 нм обусловлены переходами $4f^{14}$ - $5d^{1}4f^{13}$ в Yb²⁺. Объёмная электропроводность и пики диэлектрических потерь кристаллов LaF₃–Yb²⁺ обусловлены диполями Yb²⁺-анионная вакансия. Величина энергии активации переориентации Yb диполей равна 0.58 эВ. Проводится сравнение оптических и диэлектрических свойств Yb²⁺ центров и центров Sm²⁺, Eu²⁺ в кристаллах LaF₃, исследованных ранее.

DOI: 10.7868/S0367676517090034

ВВЕДЕНИЕ

В 80-х годах прошлого века в кристаллах фторида лантана детально исследованы оптические спектры трехвалентных редких земель RE³⁺ [1]. Интерконфигурационные *f-d-* и интраконфигурационные *f-f*-спектры двухвалентных редкоземельных ионов подробно изучены в кристаллах щелочно-земельных фторидов (см. обзоры [2, 3]). В то же время спектроскопия двухвалентных редкоземельных ионов в LaF₃ остаётся малоисследованной. По виду спектров поглощения, наведенных рентгеновским излучением, установлено, что ионы Nd, Sm, Tm, Yb частично переходят в двухвалентное состояние [4]. Однако концентрация радиационных центров невелика, что препятствует изучению диэлектрических свойств радиационно восстановленных кристаллов. В настоящей работе изучены спектры кристаллов фторида лантана с примесями Yb²⁺ (а также Sm²⁺ [5], Eu²⁺ [6]), в которых указанные двухвалентные ионы получены подбором условий выращивания в концентрации достаточной как для оптических, так и для диэлектрических измерений.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Кристаллы LaF₃ выращивались методом Стокбаргера в трехствольном графитовом тигле в вакууме. Несколько процентов CdF₂ добавлялось в сырье для очистки от примеси кислорода. Концентрация примеси REF₃ (RE редкоземельный элемент) в шихте в каждой загрузке была 0.01, 0.1 и 0.3 мол.%. Были

выращены кристаллы, содержащие только RE³⁺, а также кристаллы, в которых некоторая доля ионов трехвалентных Sm, Yb преобразована в двухвалентную форму. Ионы Еи входили только в двухвалентной форме. Вследствие наличия полос поглощения в видимой области кристаллы LaF₃, содержащие двухвалентные редкоземельные ионы, были окрашенными: LaF_3-Sm^{2+} – зеленоватые, LaF_3-Eu^{2+} и LaF_3-Yb^{2+} – желтоватые. По предварительным данным, добавление избыточного количества CdF₂ способствует восстановлению изначально трехвалентных редких земель. Были выращены кристаллы, в которых иттербий находится в трехвалентном виде, и кристаллы с частичным или полным преобразованием Yb в двухвалентную форму. Будем называть эти серии кристаллов как LaF₃-YbF₃(Yb³⁺), LaF₃-YbF₃(Yb²⁺/Yb³⁺) и LaF₃-YbF₃(Yb²⁺) соответственно.

Спектры поглощения в области 190–3000 нм измерялись на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda-950, спектры свечения и спектры в области вакуумного ультрафиолета измерялись на лабораторной установке с использованием монохроматоров BMP2 (115–300 нм) и МДР2. Источником вакуумного ультрафиолета являлась разрядная дейтериевая лампа L7292 (Hamamatsu), приемником излучения был ФЭУ142. Спектры в области 200–850 нм измерены с использованием фотомодуля Hamamatsu H6780–04.

Серебряная краска (контактол "Кеттлер") использовалась для нанесения электродов. Диаметр электродов был около 5 мм при толщине образца около 2 мм. Электрическая проводимость измерялась на переменном токе измерителем иммитанса E7–20 (МНИПИ) в частотном диапазоне 25 Гц – 1 МГц при температурах 77–400 К. Единицей измерения проводимости является сименс (См), который равен Ом⁻¹.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оптические спектры

Кристаллы, содержащие Yb³⁺, характеризуются отсутствием полос поглошения в вилимой области спектра [7] и слабыми полосами около 970 нм, обусловленными переходами²F_{7/2}-²F_{5/2} [8]. В кристаллах с полным преобразованием Yb в двухвалентную форму полосы около 970 нм отсутствуют и наблюдаются полосы в ультрафиолетовой области спектра 450-200 нм (рис. 1). Ультрафиолетовые полосы в кристаллах LaF₃-YbF₃(Yb²⁺) (а также в LaF₃-YbF₃(Yb²⁺/Yb³⁺) одной загрузки) растут с увеличением концентрации примеси YbF₂ (см. рис. 1). При низкой температуре спектры поглощения LaF₃-Yb²⁺ становятся более детальными с полосами 377, 301, 254.7, 221.5 и 201 нм (рис. 2). Отмечается, что с понижением температуры полосы Yb²⁺ смещаются в коротковолновую сторону, за исключением полосы около 370 нм, которая смещается в длинноволновую сторону. Облучение кристаллов LaF₃-Yb³⁺ рентгеновским излучением восстанавливает небольшую долю иттербия до Yb²⁺, что следует из совпадения спектров поглощения (см. рис. 2).



Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов LaF₃ с различным содержанием YbF₃ (1-0.3% YbF₃, 2-0.01% YbF₃, 3-0.1% YbF₃, 4-0.3% YbF₃) при комнатной температуре. В кристалле (1) Yb присутствует в трехвалентном виде, в остальных кристаллах Yb присутствует в двухвалентном виде. На врезке показаны спектры поглощения кристаллов в области переходов²F_{7/2}-²F_{5/2} трехвалентного иттербия.



Рис. 2. Спектры поглощения кристаллов LaF₃–YbF₃(Yb²⁺/Yb³⁺). В кристаллах (*1*–0.01% YbF₃, T = 295 K, *3*–0.01% YbF₃, T = 7.4 K) иттербий частично восстановился до двухвалентного состояния при выращивании. В кристаллах (*2*–0.3% YbF₃, T = 7.5 K) ионы Yb²⁺ образованы рентгеновским облучением при комнатной температуре. На врезке показана концентрационная зависимость полосы оптического поглощения при 370 нм кристаллов LaF₃ с полным (*1*) и частичным (*2*) восстановлением иттербия до двухвалентного состояния. Штриховая линия показывает корректированную концентрационную зависимость.

Концентрационная зависимость коэффициента поглощения в максимуме длинноволновой полосы имеет линейный характер (см. рис. 2, врезка). В кристаллах с неполным восстановлением трехвалентного иттербия наблюдается подобная концентрационная зависимость (см. рис. 2, врезка). Обе прямые не сходятся к началу координат. По всей видимости, происходит частичное перемешивание исходного сырья в трехствольном тигле при вакуумировании. Полагая, что наибольшая концентрация 0.3 мол.% YbF₃ мало изменяется при выращивании кристалла, получаем соотношение для оценки концентрации двухвалентного иттербия в LaF₃ по длинноволновой полосе поглощения при 370 нм в виде *С* (мол.%) = $k_{360\text{нм}}$ (см⁻¹) / 193 (см⁻¹ · мол.%⁻¹).

Можно переписать это соотношение в виде $N(\text{см}^{-3}) = k(\text{см}^{-1}) / \sigma(\text{см}^{2})$, где N – концентрация на кубический сантиметр, а σ – поперечное сечение полосы поглощения.

Тогда в LaF₃–Yb²⁺ для полосы 370 нм коэффициент σ будет равен 6.3 · 10⁻¹⁸ см², а для следующей полосы поглощения при 304 нм σ будет равно 9.4 · 10⁻¹⁸ см². Соотношение для оценки концентрации будет равно:

$$N (\text{cm}^{-3}) = k_{370\text{nm}} (\text{cm}^{-1}) / 6.3 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^2).$$

В статье [9] сечение поглощения σ для CaF₂-Yb²⁺ в полосе 365 нм установлено равным 7.4·10⁻¹⁸ см².



Рис. 3. Спектры комплексной проводимости кристаллов LaF₃-YbF₃ (Yb²⁺) при комнатной температуре (1 - 0.01 мол.% Yb²⁺, 2 - 0.1 мол.% Yb²⁺, 3 - 0.3 мол.% Yb²⁺). Точка пересечения с осью *х* дает значение активной проводимости кристалла [9,10]. На врезке представлена зависимость удельной активной проводимости σ_0 от коэффициента поглощения *К* длинноволновой полосы 370 нм Yb²⁺-центров.

Следует заметить, что полоса 365 нм в CaF₂ обусловлена переходами $4f^{14}-4f^{13}5d^1$ в Yb²⁺ и по типу переходов в LaF₃-Yb²⁺ ей соответствует полоса 304 нм (при комнатной температуре), величина которой несколько больше величины длинноволновой полосы 370 нм (см. рис. 1, 2), а $\sigma = 9.4 \cdot 10^{-18}$ см². Таким образом, сечения поглощения для первой полосы $4f^{14}-4f^{13}5d^1$ Yb²⁺ в CaF₂[9] и LaF₃ близки по величине.

Электропроводность

Комплексная проводимость LaF₃-Yb²⁺ (рис. 3) описывается эквивалентной цепью составленной из частотно-зависимой емкости (С_{*p*}) и частотно-независимого активного сопротивления (*R*), соединенных параллельно [10]. Подобная зависимость комплексной проводимости ранее измерена нами в LaF₃-Sm²⁺[5] и LaF₃-Eu²⁺[6], а также в LaF₃-Ba²⁺ [11]. На низкой частоте проводимость стремится к нулю. Пересечение (для идеальной цепи) кривой комплексной проводимости с осью х на высоких частотах дает правильное значение объёмной активной проводимости (далее просто проводимости) кристалла [11, 12]. Величина проводимости LaF₃ растет с увеличением концентрации Yb²⁺ (см. рис. 3). Более того, наблюдается линейная зависимость между проводимостью и оптическим поглощением Yb²⁺ в LaF₃



Рис. 4. Частотная зависимость тангенса диэлектрических потерь tg δ кристаллов LaF₃-0.3%YbF₃(Yb²⁺) при разных температурах. На врезке представлена зависимость натурального логарифма времени переориентации диполей от обратной температуры (график Аррениуса), позволяющая определить энергию вращения диполей ($E = 0.58 \pm 0.01$ эВ).

(см. врезка на рис. 3) так же, как и для Sm^{2+} [5] и Eu^{2+} [6]. Этот результат указывает на прямую взаимосвязь диполей и Yb^{2+} центров.

Частотная зависимость тангенса диэлектрических потерь tg δ (рис. 4) имеет вид кривой с максимумом около 10⁵ Гц при комнатной температуре. Пик на кривой обусловлен переориентацией диполей. Наблюдается также в несколько раз меньший слабо выраженный пик около 10³ Гц (см. рис. 4). С понижением температуры оба пика смещаются в низкочастотную область. Энергия активации вращения диполей равна 0.58 эВ (см. врезку на рис. 4). Вполне логично связать эту энергию с энергией перескока анионной вакансии возле Yb²⁺.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наблюдаемый рост электрической проводимости на переменном токе в кристаллах LaF_3 -Yb²⁺ с увеличением концентрации Yb²⁺ свидетельствует о том, что зарядокомпенсирующим дефектом для Yb²⁺ является анионная вакансия. Наблюдение пика диэлектрических потерь и уменьшение частоты максимума пика с уменьшением температуры (см. рис. 4) с энергией активации, близкой к энергии миграции анионной вакансии, указывают на то, что переориентация диполей Yb²⁺-анионная вакансия происходит путем перескоков вакансии. В спектрах диэлектрических потерь LaF₃ для ионов Sm²⁺, Eu²⁺ также наблюдались пики, связанные с переориентацией анионной вакансии около примесного иона [5, 6]. Энергии переориентации для диполей RE²⁺ в LaF₃ равны 0.48, 0.51, 0.58 эВ для Sm²⁺, Eu²⁺, Yb²⁺ соответственно. Кристаллические радиусы двухвалентных ионов уменьшаются с увеличением атомного номера в ряду Sm, Eu, Yb [13]. Причина уменьшения энергии переориентации, по-видимому, кроется в том, что с уменьшением радиуса примесного иона решетка вокруг него становится более компактной, что затрудняет перескок вакансии.

Энергия бесфононного перехода $4f^{14}-4f^{13}5d^1$ для Yb²⁺ в LaF₃, согласно полуэмпирической модели Доренбоса, равна 3.8 эВ (326 нм) [14]. Положение бесфононных переходов для полосы поглощения при 370 нм можно оценить по длинноволновому краю как 450 нм, а для полосы поглощения при 304 нм соответствующая длина волны равна 320 нм (см. рис. 1, 2). Точность оценок энергий переходов по модели Доренбоса составляет 0.1–0.2 эВ [15], поэтому можно с уверенностью заключить, что полоса при 304 нм в LaF₃-Yb²⁺ обусловлена переходами $4f^{14}-4f^{13}5d^1$, тогда как длинноволновая полоса при 370 нм имеет другую природу.

Опираясь на результаты предыдущих работ можно заключить, что в спектрах поглощения кристаллов LaF₃ с примесями Sm²⁺, Eu²⁺ или Yb²⁺ наблюдались две группы полос. Длинноволновые полосы при 550–650 нм (Sm²⁺), 330–400 нм (Eu²⁺ и Yb²⁺) обусловлены переходами с 4fⁿ основного состояния примесного иона на уровни зарядо-компенсирующей анионной вакансии. Коротковолновые полосы поглощения вызваны переходами 4fⁿ – 4fⁿ⁻¹5d¹ в примесных ионах.

Смещение длинноволновой полосы поглощения при охлаждении кристаллов в сторону низких энергий наблюдалось нами не только в LaF₃-Yb²⁺ (см. рис. 1), но и в кристаллах LaF₃-Sm²⁺ и в LaF₃-Eu²⁺. Длинноволновое смещение максимума первой полосы поглощения при охлаждении до 7.5 К равно 0.11 эВ для Sm²⁺, Eu²⁺ и 0.06 эВ для Yb²⁺. Можно предположить, что при высоких температурах RE²⁺ и вакансия сближаются за счет кулоновского притяжения. Сближение приводит к увеличению энергии переноса электрона с редкоземельного иона на вакансию.

Возбуждение в длинноволновых полосах поглощения ионов Sm^{2+} , Eu^{2+} и Yb^{2+} не приводит к появлению свечения вплоть до 7 К. По всей вероятности, после переноса электрона на вакансию происходит сильная релаксация положений окружающих ионов, связанная с увеличением радиуса вакансии с электроном и уменьшением размеров редкоземельного иона потерявшего электрон. Разность энергий основного и возбужденного состояний при таких положениях ионов решетки становится очень малой, что приводит к безызлучательным переходам либо переходам в инфракрасной области с длиной волны более 1200 нм.

Согласно оценкам 5*d*-состояние всех двухвалентных ионов в кристалле LaF₃ попадает в зону проводимости, вследствие чего люминесценция из этого состояния не должна наблюдаться [14]. В соответствии с этим, мы не наблюдали люминесценции, обусловленной переходами с 5dна 4*f*-состояния ни в одном из трех ионов Sm^{2+} , Eu^{2+} , Yb²⁺. У иона Sm²⁺ имеются возбужденные 4f-состояния ниже дна зоны проводимости, что позволило нам наблюдать переходы с возбужденных ${}^{5}D_{i}$ (j = 0, 1, 2) на состояния ${}^{4}F_{i}$ (i = 0, 1, 2) 2, 3, 4, 5) [4]. Широкая бесструктурная полоса свечения LaF₃-Eu²⁺ обусловлена так называемой аномальной люминесценцией (переходами с дна зоны проводимости на 4*f*-уровень Eu^{2+}) [6]. Необходимым условием возникновения аномальной люминесценции является расположение возбужденного уровня в зоне проводимости, что выполняется для всех двухвалентных редкоземельных ионов в LaF₃ [14]. Однако аномальная люминесценция, вызванная переходами с зонных состояний на основное состояние трехвалентного редкоземельного иона, наблюдалась нами только в кристаллах LaF₃-Eu²⁺ [6]. В кристаллах LaF₃-Yb²⁺ люминесценция при возбуждении в $4f^{14}-4f^{13}5d^{1}$ -полосах не обнаружена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобно центрам Sm^{2+} , Eu^{2+} основное состояние центров Yb^{2+} в LaF_3 описывается конфигурацией Yb^{2+} -анионная вакансия. Перескоки вакансии около Yb^{2+} (с энергией переориентации диполя 0.58 эВ) приводят к появлению проводимости на переменном токе и появлению пика диэлектрических потерь.

Длинноволновая полоса поглощения при 370 нм соответствует переходам электрона с $4f^{14}$ уровня Yb²⁺ на анионную вакансию, остальные полосы обусловлены переходами $4f^{14}-4f^{13}5d^1$ в ионе Yb²⁺. Люминесценция, связанная с Yb²⁺-центрами, не обнаружена.

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП "Изотопно-геохимических исследований" ИГХ СО РАН. Авторы благодарны В. А. Козловскому за выращивание кристаллов фторида лантана с редкоземельными примесями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Carnall W., Goodman G. L., Rajnak K., Rana R. S. // J. Chem. Phys., 1989. V. 90. P. 3443.
- 2. Герлих П., Каррас Х., Кетитц Г., Леман Р. Спектроскопические свойства активированных лазерных кристаллов. М.: Наука, 1966. 207 с.
- 3. *Dieke G. H.* Spectra and energy levels of rare earth ions in crystals. Intersc. Publ., 1968. 401 p.
- Раджабов Е. А. // Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 121. Вып. 4. С. 25.
- Radzhabov E. A., Kozlovskii V. A. // Phys. Proc. 2015.
 V. 76. P. 47.
- Radzhabov E. A., Shendrik R. Yu. // Rad. Measurements. 2016. V. 90. P. 80.

- Heaps W. S., Elias L. R., Yen W. M. // Phys. Rev. B. 1976.
 V. 13. P. 94.
- Rast H. E., Caspers H. H., Miller S. A. //. J. Chem. Phys. 1967. V. 47. P. 3874.
- 9. Shcheulin A. S., Angervaks A. E., Semenova T. S. et al. // Appl. Phys. B. 2013. V. 111. P. 551.
- 10. *Иванов-Шиц А.К., Мурин И. В.* Ионика твердого тела. СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2000. 615 с.
- Roos A., Franceschetti D., Schoonman J. // J. Phys. Chem. Solids. 1985. V. 46. P. 645.
- Schonhals A., Kremer F. Analysis of dielectric spectra. / Broadband Dielectric Spectroscopy. Springer, 2003. P. 59.
- 13. Jia Y. Q. // J. Sol. St. Chem. 1991. V. 95. P. 184.
- 14. Dorenbos P. // J. Luminescence. 2013. V. 135. P. 93.
- 15. Zych A., Ogieglo J., Ronda C. et al. // J. Luminescence. 2013. V. 134. P. 174.